

# PCB 제조공정 환경 데이터분석

유환호 이수정 호인성 황 희

## INDEX

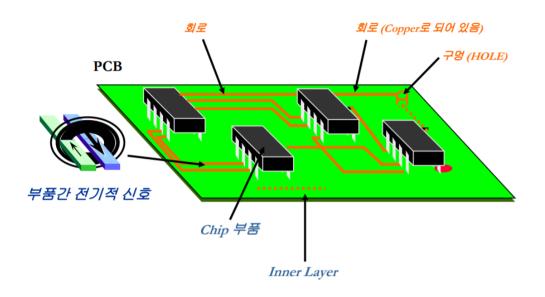
- 1. 프로젝트 배경
  - PCB 소개
  - 문제 정의 및 주제 선정
- 2. 데이터 정제
  - 데이터 설명
  - 데이터 전처리
  - 데이터 병합
- 3. 데이터 분석
  - 노광공정 기기별 불량률 차이
  - 이물질 관리기준 정의
- 4. 결론 및 문제점
  - 결론
  - 연구한계

### 프로젝트 배경 1) PCB 소개

PCB란?

Printed Circuit Board

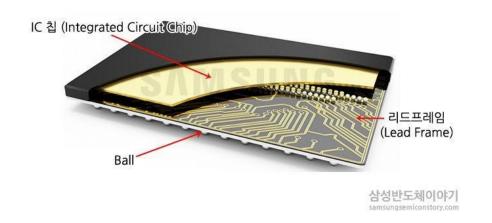
절연판 위와 그 내부에 회로를 형성하여 그 위에 탑재된 부품을 전기적으로 연결시켜 동작시키는 기판



#### 용도

프로젝트 배경

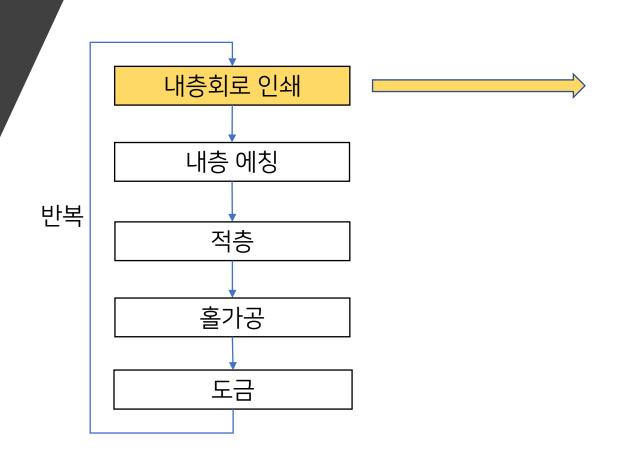
반도체 후공정(패키징 단계)에서 직접회로를 탑재될 기기에 적합한 형태로 연결하는 역할





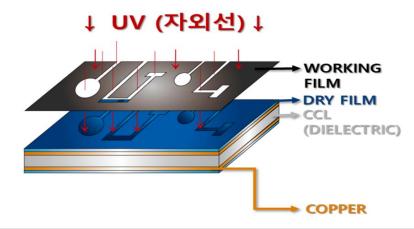
### **프로젝트 배경** 1) PCB 소개

PCB 제조 공정



#### 노광공정?

프로젝트 배경



Dry film이 입혀진 동판(Copper) 위에 회로의 이미지를 형성하는 작업

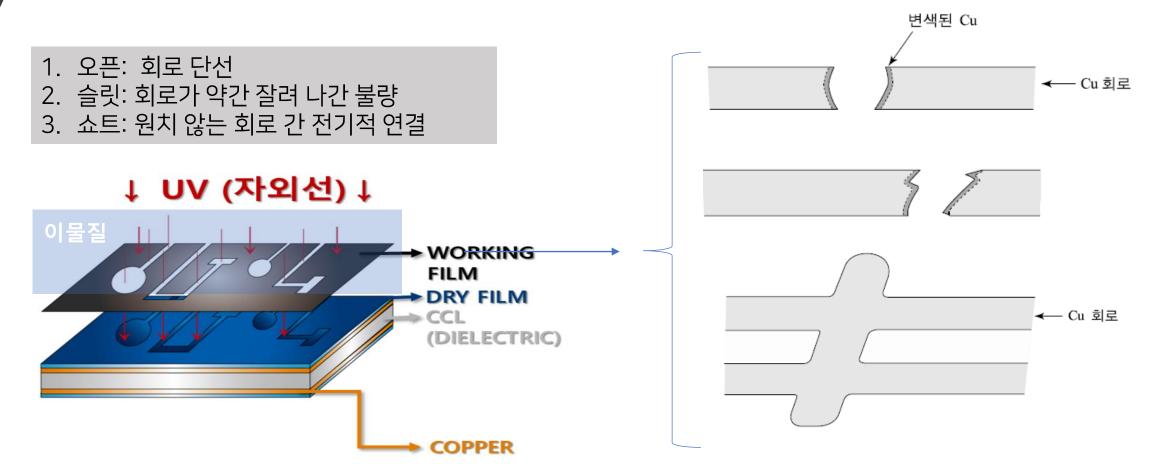
Dry film은 노광 빛(UV자외선)에 노출되면 감광되는 특징이 있어 이를 활용해 회로가 될 곳은 빛에 노출시키고 공간이 될 곳은 빛을 차단하는 방법으로 상을 형성

미세회로 작업이기 때문에 외부 환경요인을 통제하고 빛에너지 노출의 일정한 강도와 시간의 유지가 중요



### **프로젝트 배경** 1) PCB 소개

노광에서 발생하는 불량 유형 파악





### **프로젝트 배경** 2) 문제 정의 및 주제 선정

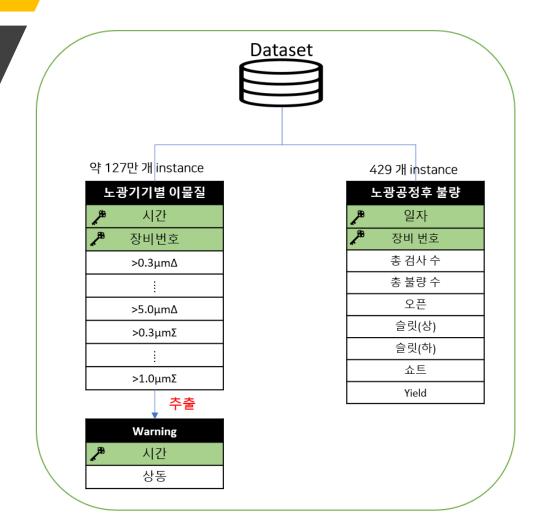
### 노광공정 기기별 불량률 차이

- 엔지니어분들의 도메인 지식에 의존한 관리 규정 검토
- 노광기기 별로 외부 환경 요인을 잘 통제하고 있을까?

### 이물질 사이즈 관리기준 정의

- 이물질 사이즈와 불량률과의 관계 파악

## **더이터 정제** 1) 데이터 설명



#### 노광기기별 이물질 데이터 (예시 : 1호기)

장비번호	날짜시간(yyyymmddhhmmss)	>0.3µm∆	>0.5µm∆	>1.0µm∆	>5.0µm∆	>0.3μmΣ	>0.5μmΣ	>1.0μmΣ
노광1호기	2020-07-23 16:23:29	23	2	0	0	25	2	0
노광1호기	2020-07-23 16:23:30	21	7	0	0	28	7	0
노광1호기	2020-07-23 16:23:31	21	2	1	0	24	3	1
노광1호기	2020-07-23 16:23:32	22	6	0	0	28	6	0
노광1호기	2020-07-23 16:23:33	22	4	0	0	26	4	0

#### 노광공정 후의 불량데이터

장비 번호	일자	총 검사 수	총 불량 수	오픈	슬릿(상)	슬릿(하)	쇼트	Yield(%)
노광1호기	2020-04-01	10368	65	1061	96	675	193	99.37
노광1호기	2020-04-04	39636	221	202	101	303	429	99.44
노광1호기	2020-04-22	10696	161	1028	93	654	467	98.49
노광1호기	2020-04-23	10752	160	651	0	1395	1953	98.51
노광1호기	2020-04-24	16128	285	434	372	434	992	98.23
노광1호기	2020-04-25	10752	298	2418	465	930	2883	97.23
노광1호기	2020-04-27	22032	405	817	182	227	1589	98.16
노광1호기	2020-04-28	5376	132	2232	1302	186	5022	97.54

프로젝트 배경



#### 1) 데이터 설명

#### 불량데이터

■ 노광기별 공정 후 불량 발생

No.	필드명	데이터형	내용
1	일자	날짜	검사일자
2	장비번호	일련번호	노광기 4대에 대한 정보 (1,2,4,5호기)
3	총 검사 수	수치형	노광공정 후 검사한 제품 개수
4	총 불량 수	수치형	검사에서 발견된 모든 불량 수
5	오픈	수치형	여러 불량 유형 중 파티클에 민감한 유형1
6	슬릿(상)	수치형	여러 불량 유형 중 파티클에 민감한 유형2
7	슬릿(하)	수치형	여러 불량 유형 중 파티클에 민감한 유형3
8	쇼트	수치형	여러 불량 유형 중 파티클에 민감한 유형4
9	Yield	수치형	수율 = 1-불량률

Table Size: 429x10

#### EX)

일자	장비번호	총 검사 수	총 불량수	오픈	슬릿(상)	슬릿(하)	쇼트	Yield
2020-04-01	1	10368	65	1061	96	675	193	99.37

#### 환경데이터

■ 노광기 호기별 이물질 측정

No.	필드명	데이터형	내용
1	Time	시간	단위 시간
2	장비번호	일련번호	장비 호기 표시
3	0.3μmΔ	수치형	개별 파티클 개수
i	1	1	1
6	5.0μmΔ	수치형	개별 파티클 개수
7	>0.3μmΣ	수치형	합산 파티클 개수
i	1	1	
9	>1.0μmΣ	수치형	합산 파티클 개수

Table Size: 12710230x9

#### Warning

No.	필드명	데이터형	내용
상동	상동	상동	상동

Table Size: 1423x9



### 불량데이터 조정

특정 4가지 요인에 의한 불량 검출 수 및 수율 컬럼 생성

Ex) 노광 1호기

•	단우	:ppm —		
오픈	슬릿(상)	슬릿(하)	쇼트	Yield(%)

일자	총 검사수	총 불량수	오픈	슬릿(상)	슬릿(하)	쇼트	Yield(%)
2020-04-01	10368	65	1061	96	675	193	99.37
2020-04-04	39636	221	202	101	303	429	99.44



ppm을 개수로 환산

불량건수 = (PPM 수치 X 총 검사수량) / 1,000,000

결론 및 문제점



#### 3) 데이터 병합

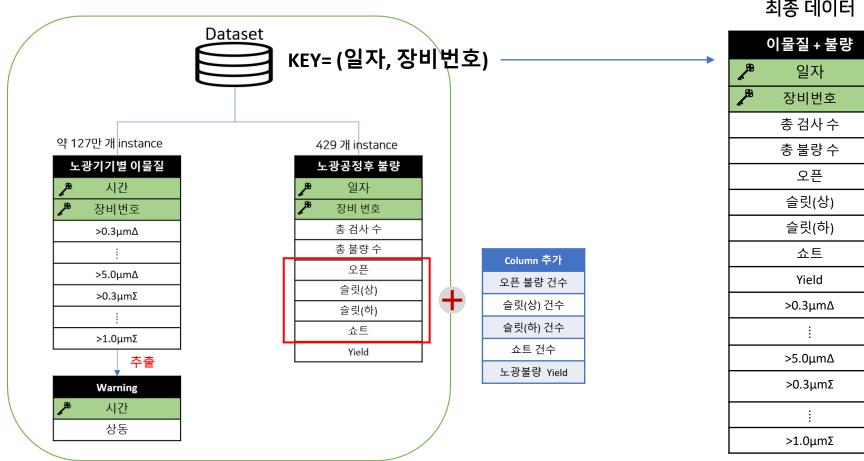
#### 환경데이터 시간 병합

- 각각의 환경데이터의 시간을 일단위로 병합 후 통합 환경데이터 생성
- record축소 효과





### 환경데이터 시간 병합



#### 최종 데이터

	이물실 + 불당				
<b>₽</b>	일자				
<b>*</b> ***********************************	장비번호				
	총 검사 수				
	총 불량 수				
오픈					
슬릿(상)					
슬릿(하)					
쇼트					
Yield					
	>0.3μmΔ				
	i i				
	>5.0μmΔ				
	>0.3μmΣ				
	i i				
	>1.0μmΣ				

Table Size: 312x60



#### 1) 노광공정 기기별 불량률 차이

#### 노광기기별 특징

1. 수동 아날로그, 자동 디지털 방식의 차이

- 1,2호기: 아날로그

- 4,5호기: 디지털

2. 연식의 차이

- 4호기: 연식 5년

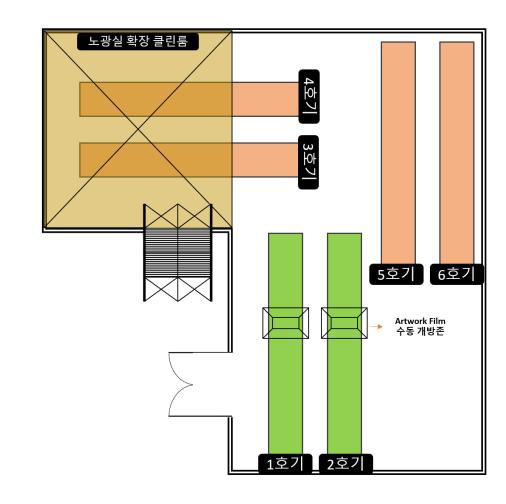
- 5호기: 연식 2년

3. 출입문과 장비 거리

- 1,2호기: 통로 앞

<노광실 도면>

프로젝트 배경





프로젝트 배경 데이터 정제 **데이터 분석** 



#### 1) 노광공정 기기별 불량률 차이

#### 노광호기별 모부적합품률의 차이 검정

- ✓ 디지털 기기와 아날로그 기기 간 불량률의 차이가 있는지 통계적으로 검정
  - 1,2호기(아날로그) / 4,5호기(디지털)
  - 아날로그 방식은 사람이 직접 기기 개폐 후 Dry film 부착
- ✓ 1호기와 2호기 간 모부적합품률에 차이가 존재하는지 검정
  - 상대적으로 출입문과 가까운 아날로그 기기의 부적합품률이 실제로 높은지 검정
- ✓ 디지털 기기의 연식 차이가 불량률과 관련이 있는지 검정
  - 4호기(5년) 5호기(2년)

결론 및 문제점



#### 1) 노광공정 기기별 불량률 차이

프로젝트 배경

#### 노광호기별 모부적합품률의 차이 검정

#### 1. 이항분포의 정규분포 근사 조건 :

 $nP_0 \ge 5$  이고,  $n(1 - P_0) \ge 5$ 일때, 혹은 샘플의 수 n이 매우 클 때

#### 2. 가설 설정

 $H_0: P_A \geq P_B$  (집단 A의 모부적합품률보다 집단 B의 모부적합품률이 크다)

 $H_1: P_A < P_B$  (집단 A의 모부적합품률보다 집단 B의 모부적합품률이 작다)

 $P_A$ : 집단 A의 모부적합품률

 $P_R$ : 집단 B의 모부적합품률

#### 3. 검정통계량 계산

$$u_0 = \frac{\hat{p}_A - \hat{p}_B}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B})}}$$

 $x_A = A 집단의 부적합품 수$  $n_A$  = A집단의 총 검사 수량

 $x_B$ = B집단의 부적합품 수  $n_B$  = B집단의 총 검사 수량

$$\hat{p}_A = \frac{x_A}{n_A}$$

$$\hat{p} = \frac{x_A + x_B}{n_A + n_B}$$



### **데이터 분석**

#### 1) 노광공정 기기별 불량률 차이

#### 노광호기별 모부적합품률의 차이 검정

#### **4.** 기각역 설정

$$u_0 < -u_{1-\alpha}$$

$$u_0 < -1.645$$

#### 5. 판정

ex) 유의수준 α = 0.05이고, 검정통계량이 -4.2882인 경우

$$u_0 = -4.28823 < -1.645$$

 $u_0 = -4.28823 < -1.645$  : 귀무가설(H0) 기각, 대립가설(H1) 채택

결론 : 집단 A의 모부적합품률은 집단B의 모부적합품률보다 작다고 할 수 있다.

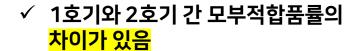


#### 1) 노광공정 기기별 불량률 차이

#### 노광호기별 모부적합품률의 차이 검정 결과

구분		아날로그 vs 디지털	1호기 vs 2호기	4호기 vs 5호기
검정통계랑		-10.503996	-4.28823	-10.40706
검정 결과		디지털기기의 모부적합품률이 더 크다	2호기의 모부적합품률이 더 크다	5호기의 모부적합품률이 더 크다
	오픈	<	<	<
	エ	-14.70788	-4.38562	-7.77205
	슬릿(상)	>	>	<
물 량	르자(6)	3.79329	6.535939	-6.715724
개 하 아 정	스리(하)	<	<	=
	슬릿(하)	-9.9696	-7.943023	0.764496
	쇼트	>	Ш	<
	ш=	3.174542	-0.22536	-7.30648





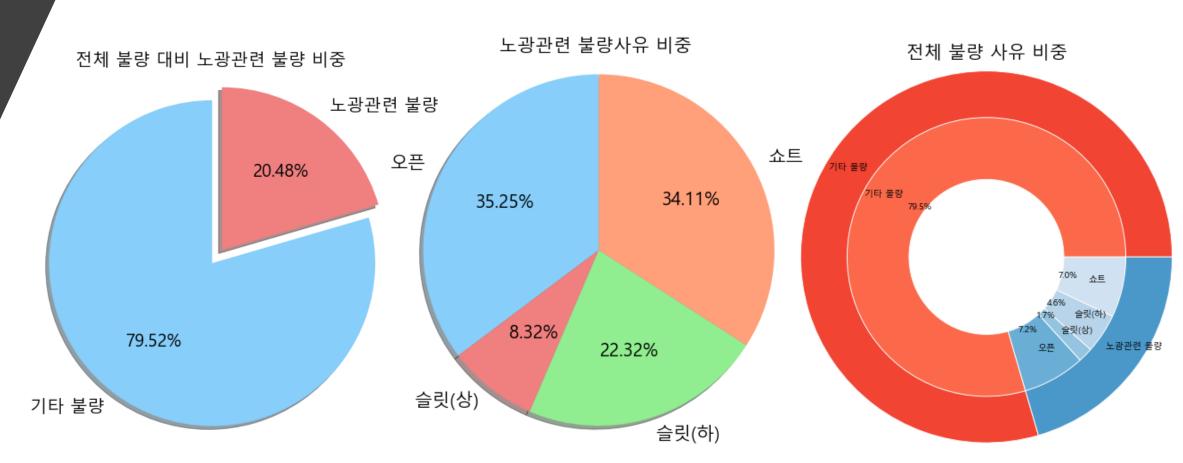
✓ 기기의 연식이 오래 됨에 따라 부적합품률이 증가한다고 볼 수 없음





#### 2) 이물질 사이즈 관리기준 정의

#### 불량 데이터 사유별 비중



\* 불량건수 = (PPM 수치 X 총 검사수량) / 1,000,000



데이터 분석

결론 및 제언



#### 2) 이물질 사이즈 관리기준 정의

프로젝트 배경

#### 환경데이터와 불량데이터 간 동일성 검정

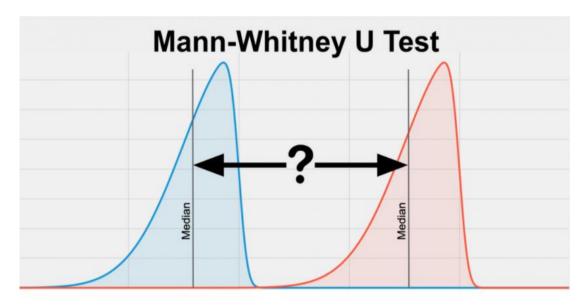
- Mann-whitney U test (비모수 검정)

정규성을 만족하지 않는 두 데이터의 분포에 대해 두 집단의 차이를 분석하는 방법 두 그룹의 자료를 혼합한 뒤 순위를 매기고 (동점인 경우 평균 사용), 그것의 통계적 차이가 유의한지를 파악한다

- 특징
- 1. 치우친 분포에도 사용이 가능함
- 2. 가정이 필요 없음 (표준편차, 평균 상관X)

#### 가설

 $H_0$ :두 집단의 분포는 동일하다  $H_1$ :두 집단의 분포는 동일하지 않다



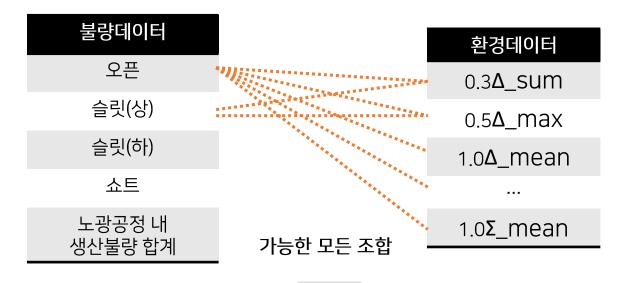
통계량 두 모집단의 혼합표본 
$$W = \sum_{j=1}^{n} R_{j} \longrightarrow \{ \ X_{1}, X_{2}, \cdots X_{i} \cdots, X_{m} \ , \ Y_{1}, Y_{2}, \cdots Y_{j} \cdots, Y_{n} \ \}$$
 에서 Yj 의 순위 
$$U = W - \frac{n(n+1)}{2}$$



#### 2) 이물질 사이즈 관리기준 정의

#### 환경데이터와 불량데이터 간 동일성 검정

두 데이터 분포의 동일성을 Mann-whitney U test를 통해 검정





결론 및 문제점



### **데이터 분석**

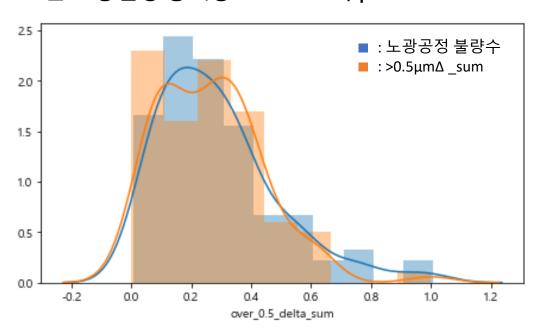
#### 2) 이물질 사이즈 관리기준 정의

노광기: 노광기 전체

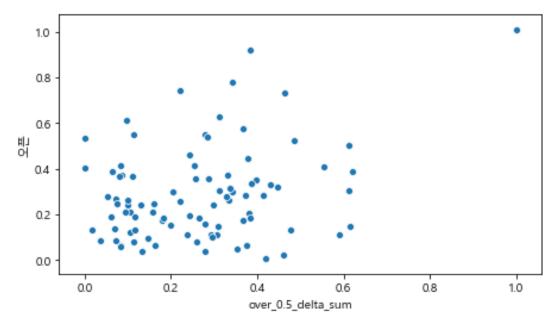
불량데이터 column: 노광공정 내 불량 수

환경데이터 column : > 0.5μmΔ\_sum(일별 합계)

분포 동일성 통계량 : 45961.5, pvalue=0.33027



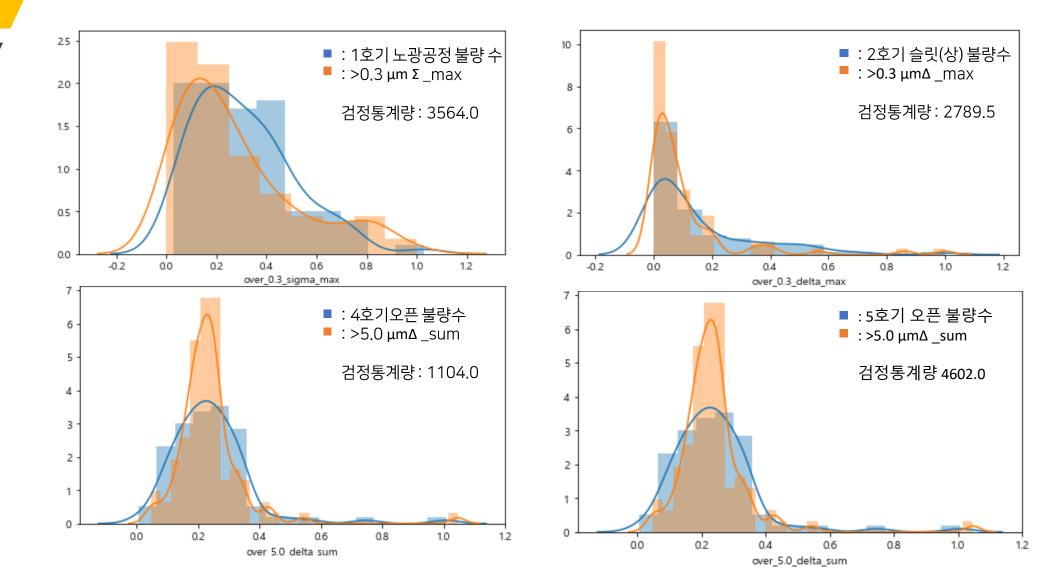
Pearson's corr: 0.29349





#### 2) 이물질 사이즈 관리기준 정의

프로젝트 배경



프로젝트 배경 데이터 정제 데이터 분석 **결론 및 문제점** 



### 노광기별 관리기준 데이터

노광기 번호	불량데이터	환경데이터	유의한 변수 개수
1	노광공정 내 불량 수	> 0.3μm Δ_max(일별 최대값), ···	25
2	노광공정 내 슬릿(상)불량 수	> 0.3μmΔ_max(일별 최대값), ···	8
4	노광공정 내 불량 수	> 1.0μmΔ_max(일별 최대값), ···	7
5	노광공정 내 오픈불량 수	> 5.0μmΔ_sum(일별 합계), ···	12
전체	노광공정 내 불량 수	> 0.3μmΔ_max(일별 최대값), ···	18

0.3 μm Δ\_max(일별 최대값)가 분포 유사도 가장 많이 확인

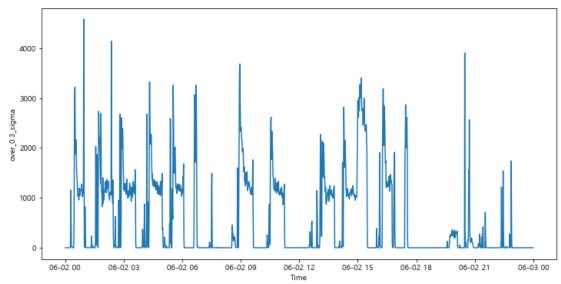
요약



#### 데이터 수집 조건 세분화가 필요

ex) 2020.06.02의 0.3Σ 데이터

데이터 수 : <mark>89000</mark>



불량 데이터의 시간기준을 세분화할 필요가 있다

데이터 수 : <mark>1</mark>

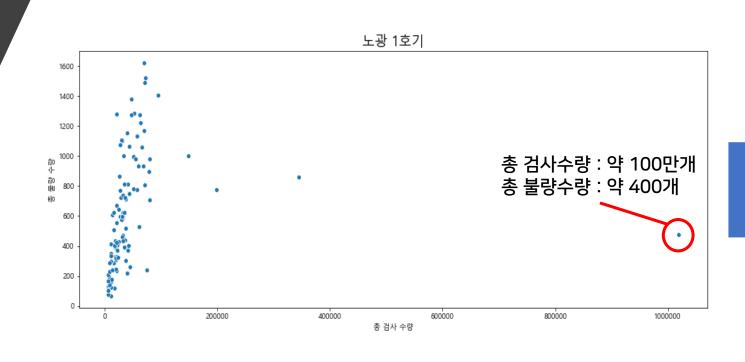
날짜	2020.06.02
Sum	148100
Mean	1422
Max	4881
•••	•••



노광기 내 생산 불량 수량 (2020.06.02) 63.03024

## 💽 <mark>연</mark>구 한계

#### 데이터 수집 조건 세분화가 필요



문의결과 이상값이 아님

제품별로 검사 PCS수가 다른데, 제품별 검사, 불량 구분은 되어있지 않음

불량 데이터를 제품별로 구분할 필요가 있다



### **말 방**법론 검토

#### 이물질 데이터 개수 선정 방식

#### <u>정리</u>

X = 이물질 사이즈별 대표값

y = 슬릿(상)에 대한 등급

- PASS: 50% 이하 / ERROR: 50% 이상

중앙값: 9,49개

1. Grid Search -> Dept: 3

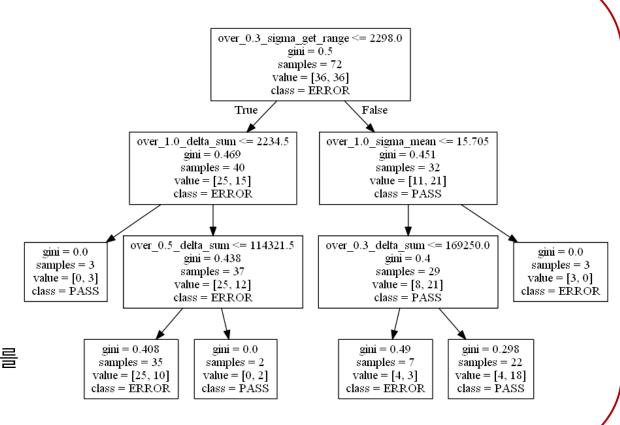
2. 훈련 데이터 정확도: 76.38%

3. 검증 데이터 정확도: 66%

차이: 10.38%

- 하계

:입력 데이터의 정밀도만큼 관리 기준 모델 정확도를 개선할 수 있음



결론 및 문제점